Московский Физико-Технический Институт

Кафедра радиоэлектроники и прикладной информатики

Практическая работа 201D-1

Динамические характеристики полупроводниковых диодов

Работу выполнил Ринат Валиев, 711 гр.

Под руководством Д.Н. Щелкунова

Оборудование

В работе используется набор диодов №2.

Импульсный	Выпрямительный	Выпрямительный	Варикап	Стабилитрон
ВЧ диод	НЧ диод	диод Шоттки		
D1N4149	D1N4002	D1N5818	D1N5443A	D04AZ2_2

Таблица 1: Диоды, содержащиеся в используемом наборе

Приведем некоторые характеристические параметры для диодов из таблицы 1.

D1N4149: Is=2.682n N=1.836 Rs=.5664 Ikf=44.17m Xti=3 Eg=1.11 Cjo=2p M=.3333 Vj=.5 Fc=.5 Isr=1.565n Nr=2 Bv=100 Ibv=100u Tt=11.54n

D1N4002: Is=14.11E-9 N=1.984 Rs=33.89E-3 Ikf=94.81 Xti=3 Eg=1.110 Cjo=51.17E-12 M=.2762 Vj=.3905 Fc=.5 Isr=100.0E-12 Nr=2 Bv=100.1 Ibv=10

D1N5818: Is=2.835u Rs=47.12m Ikf=.3227 N=1 Xti=0 Eg=1.11 Cjo=359.3p M=.6513 Vj=.75 Fc=.5 Isr=26.46u Nr=2

D1N5443A: Is=10.51E-18 Rs=.1 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=21.95p M=.426 Vj=.75 Fc=.5 Isr=12.84p Nr=2 Bv=30 Ibv=10u

D04AZ2_2: Rs=1.000E-3 Cjo=1.000E-12 M=.3333 Vj=.75 Isr=96.31E-6 Bv=2.260 Ibv=51.73E-3 Tt=5.000E-9

Схемы для исследования диодов:

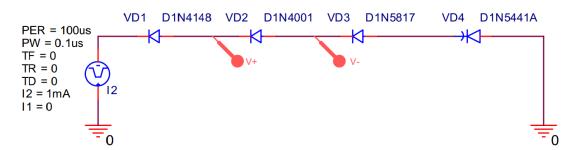


Рис. 1: Схема моделирования заряда барьерной емкости

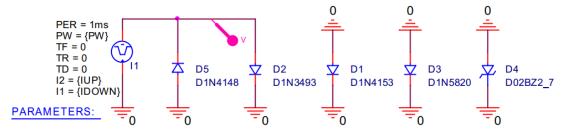


Рис. 2: Схема моделирования процесса рассасывания неосновных носителей

 $^{^{1}}$ Диоды аналогичны указанным в наборе из таблицы 1

2.1. Барьерная ёмкость

Заряд барьерной ёмкости

2.1.1. Соединим диоды (кроме стабилитрона) по схеме, изображенной на рис. 1. Установим параметры импульса: исходное состояние I1=0, амплитуда импульса $I2=1\mathrm{uA}$ - $10\mathrm{mA}$ (зависит от диода), задержка $\mathrm{TD}=0$, длительность фронта $\mathrm{TR}=0$, длительность спада $\mathrm{TF}=0$, длительность вершины импульса $\mathrm{PW}=10\mathrm{us}$, период повторения $\mathrm{PER}=100\mathrm{us}$.

Для каждого диода подоберем I2 и Run to Time так, чтобы обратное напряжение к концу интервала наблюдения достигало 10V - 50V, но не превышало напряжения пробоя (Вv в модели). Амплитуда тока I2 должна быть много больше максимального обратного тока диода.

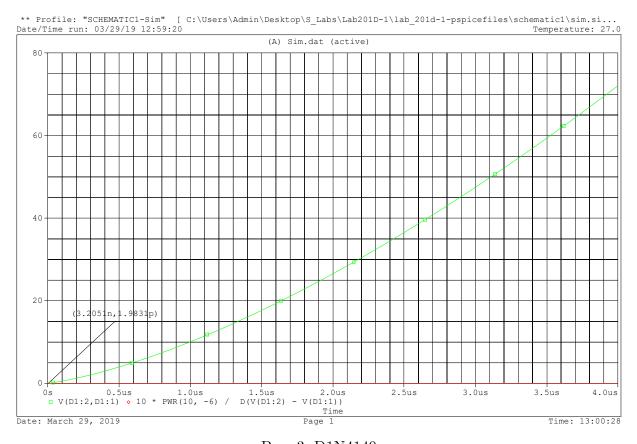


Рис. 3: D1N4149

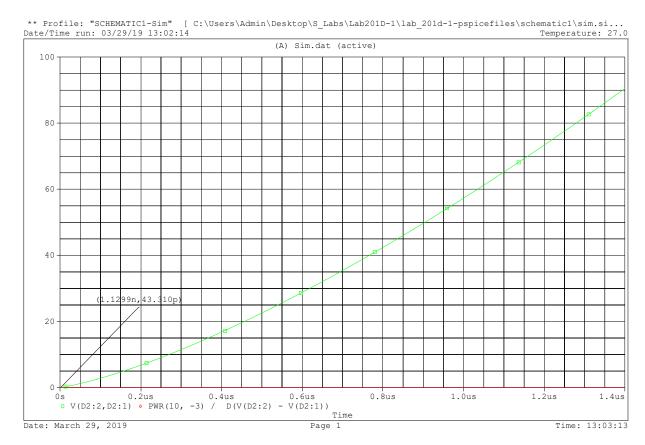


Рис. 4: D1N4002

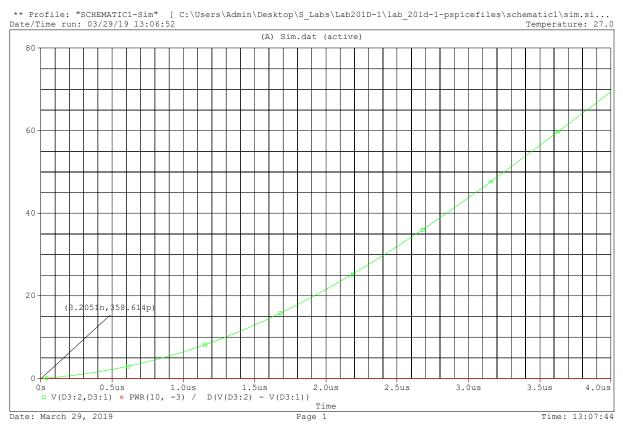


Рис. 5: D1N5818

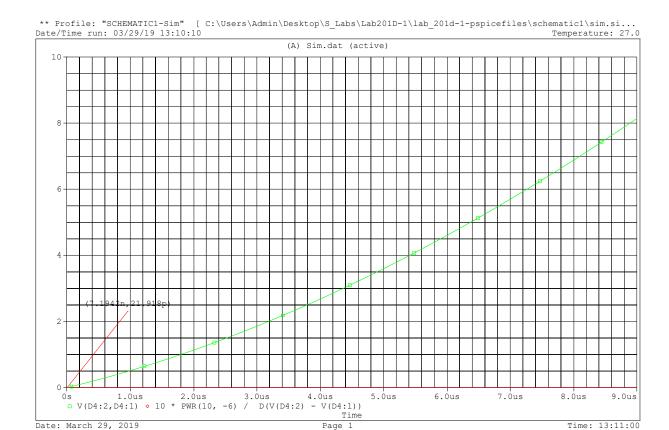


Рис. 6: D1N5443A

2.1.1.а. Из временных диаграмм каждого диода определим производную и рассчитаем величину барьерной ёмкости C_{j0} при нулевом напряжении на диоде:

$$C_{j0} \approx \left(I_2 / \frac{\Delta U}{\Delta t}\right)$$

Сравним результаты со значениями C_{i0} модели.

Значения барьерных ёмкостей были получены с помощью рассчетного блока **OrCAD** и приведено на графиках, изображённых выше.

	D1N4149	D1N4002	D1N5818	D1N5443A
Эксп. C_{j0}	2p	43p	359p	22p
Teop. C_{j0}	2p	51p	359p	22p

Таблица 2: Сравнение значений барьерных емкостей

Зависимость барьерной ёмкости от напряжения и температуры

2.1.2. Для каждого диода составим схему моделирования зависимости барьерной емкости от "обратного" напряжения (рис. 7). Получим зависимости токов от времени. По известной крутизне и емкости конденсатора определим масштаб напряжения (горизонтальной оси) и масштаб емкости (вертикальной оси).

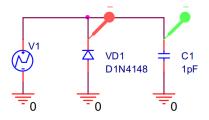


Рис. 7: Схема соединения

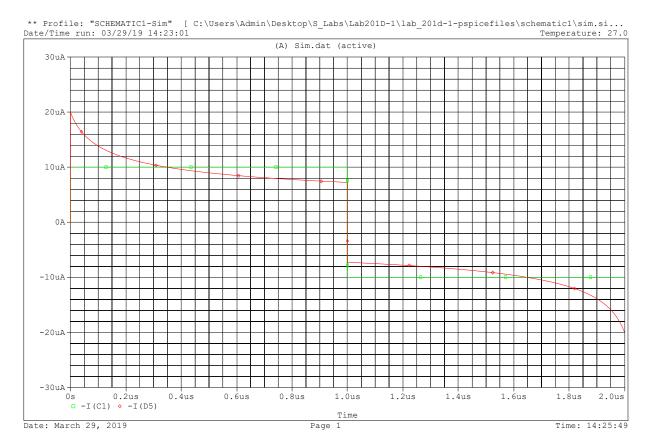


Рис. 8: D1N4149

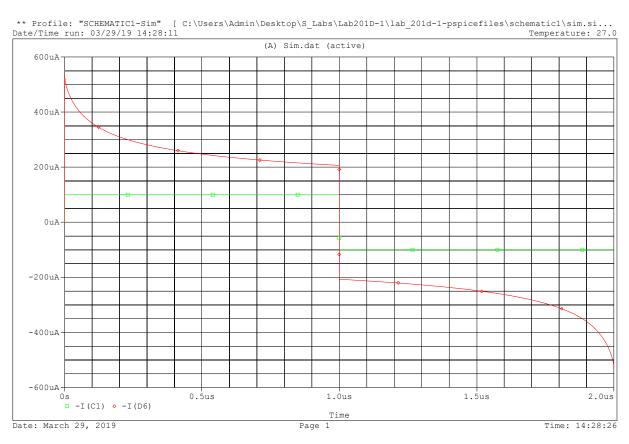


Рис. 9: D1N4002

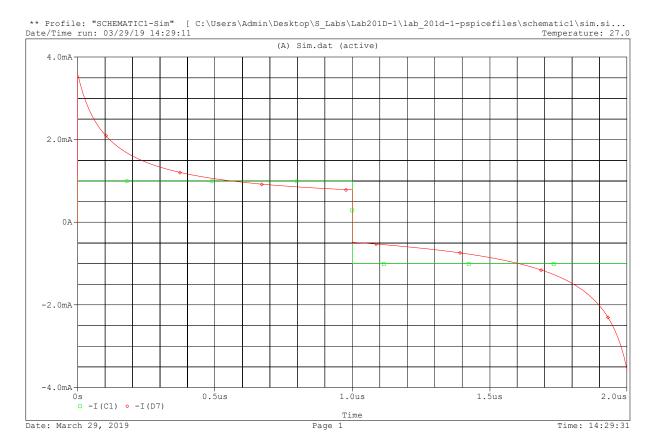


Рис. 10: D1N5818

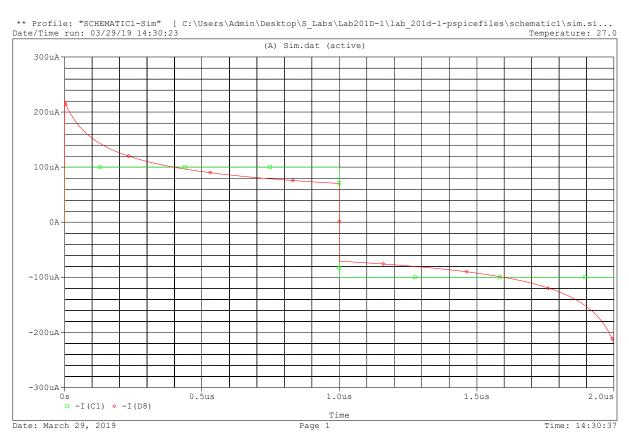


Рис. 11: D1N5443A

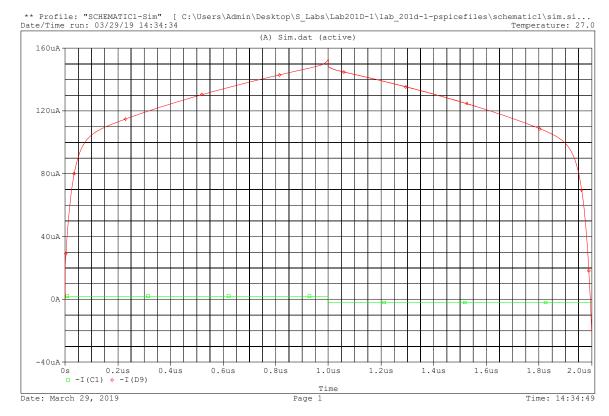


Рис. 12: D04AZ2_2

2.1.2.а. Для импульсного ВЧ диода дополнительно для –60, 27,120 градусов Цельсия получим семейство температурных зависимостей барьерной ёмкости.

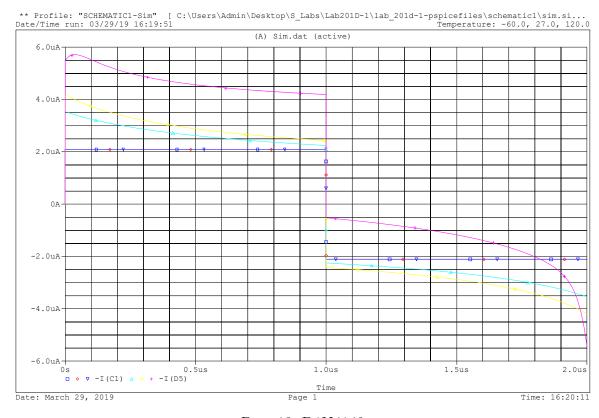


Рис. 13: D1N4149

 $T = -60^{\circ} \text{C}: \quad C_{\text{6ap}} = 1.8 pF$

 $T = 27^{\circ}\mathrm{C}: \quad C_{6\mathrm{ap}} = 2pF$

 $T = 120^{\circ} \text{C}: \quad C_{\text{6ap}} = 2.39 pF$

2.1.2.б. Проверим соответствуют ли полученные в пункте 2.1.2 зависимости барьерных емкостей диодов от напряжения теоретической зависимости. Определим U_0 .

D1N4149: $U_0 = 1.67V$ D1N4002: $U_0 = 2.11V$ D1N5818: $U_0 = 2.53V$

D1N5443A: $U_0 = 2.12V$ Для стабилитрона приближение не выполняется.

2.1.2.в. Предложим метод получения зависимости барьерной емкости от обратного напряжения при сравнимых токах $C \cdot dU/dt$ и I_{sr} .

При выбранных масштабах крутизны и емкости можно будет построить сдвоенную систему координат, затем из-за линейности импульсов источника можно будет определить величину барьерной ёмкости через ёмкость нормировочного конденсатора.

2.1.2.г. Как зависит оценка (по результатам моделирования) C_{j0} от обратного тока лиола?

Линейным образом в области нормировки дополнительным конденсатором согласно устройству источника.

2.2 Диффузионная ёмкость

2.2.1. Импульсами тока этого генератора накапливаются неосновные носители ("заряжается диффузионная емкость") исследуемого диода, а в паузе между импульсами рассасываются не основные носители ("диффузионная емкость разряжается"). Время разряда диффузионной емкости определяется по задержке начала разряда барьерной емкости после спада импульса I1.

Проведем временное моделирование для напряжения на диоде. Для каждого диода подоберем параметры PW импульсов, Run Time и Maximum step size.

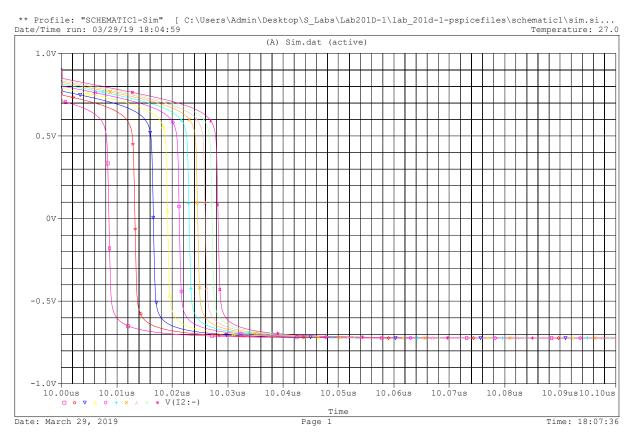


Рис. 14: D1N4149

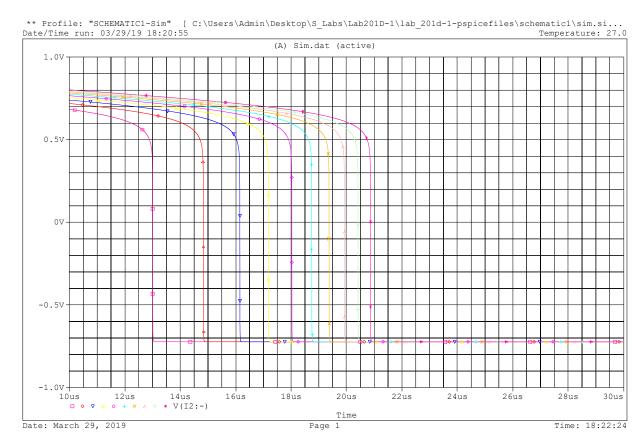


Рис. 15: D1N4002

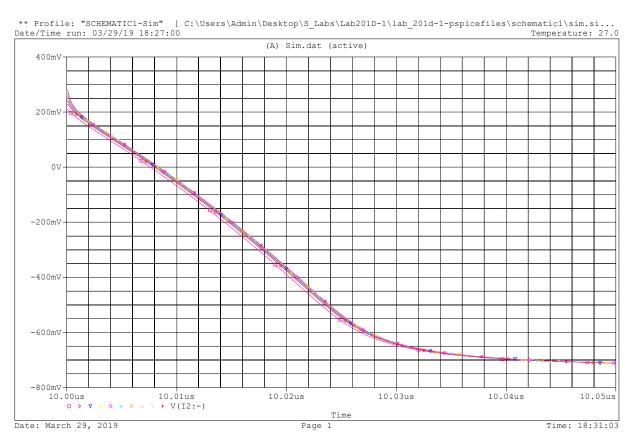


Рис. 16: D1N5818

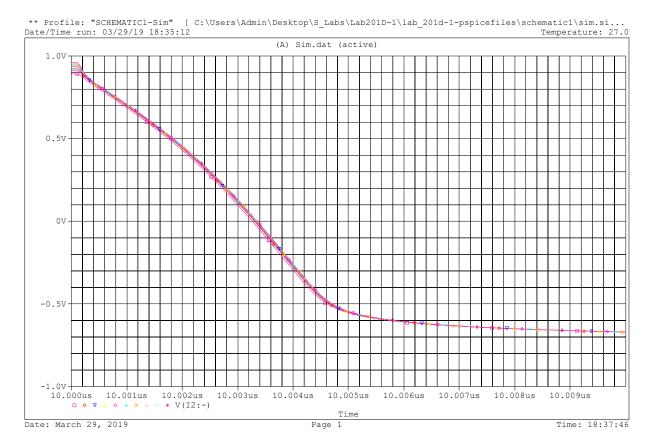


Рис. 17: D1N5443A

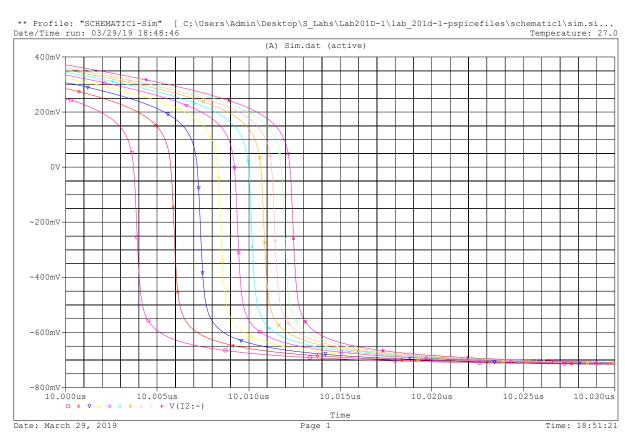


Рис. 18: D04AZ2_2

2.2.1.а. Для импульсного ВЧ диода по скачку напряжения рассчитаем сопротивление R_s . Сравним с паспортными данными модели.

$$R_s = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{0.872 - 0.816}{0.1} \Omega \approx 0.56\Omega$$

 $R_s^{\text{Ta6}_{\scriptscriptstyle J}} = 0.5664\Omega$

2.2.1.6. Для импульсного ВЧ диода для I1 = 10mA и дискретных значений IUP = I2 = 17.21mA, 100mA напечатаем на графике время разряда диффузионной ёмкости. Рассчитаем время жизни ННЗ для I2 = 17.21mA и время разряда диффузионной ёмкости для I2 = 100mA.

** Profile: "SCHEMATIC1-Sim" [C:\Users\Admin\Desktop\S_Labs\Lab201D-1\lab_201d-1-pspicefiles\schematic1\sim.si...
Temperature: 27.0

(A) Sim.dat (active)

1.0V

0.5V

(10.012u,0.000) (10.02Bu,0.000)

0V

-0.5V

10.000us 10.005us

• V(I2:-)

Date: March 29, 2019

10.010us

10.015us

Рис. 19: D1N4149

10.025us

Time: 19:10:48

10.020us

$$\tau_{\rm pac} = 6ns; \ \tau_p = \frac{\tau_{\rm pac}}{1 + ln\left(\frac{I_2}{-I_1}\right)} = 3.7ns$$

$$\tau_{\rm pac} = 14ns; \ \tau_{\rm pac} = \tau_p \cdot \left(1 + ln\left(\frac{I_2}{-I_1}\right)\right) = 11.8ns$$

2.2.1.в. Оценим по результатам моделирования пункта 2.2.1 заряд неосновных носителей выпрямительного диода при заданном токе.

$$Q = |I_1 \cdot \tau_p| \approx 40 pC$$
 для каждого из токов I_2

2.2.1.г. Объясним различие графиков разряда ёмкостей диода Шоттки и обычных диодов.

В диодах Шоттки в качестве барьера Шоттки используется переход металл - полупроводник, в отличие от обычных диодов, где используется p-n-переход. Особенностью такого перехода является отсутствие накопления избыточного заряда в базе. Инерционные свойства такого диода связаны с зарядом в барьерной емкости. Переход металл-полупроводник обладает рядом особенных свойств (отличных от свойств полупроводникового p-n-перехода). К ним относятся: пониженное падение напряжения при прямом включении, высокий ток утечки, очень маленький заряд обратного восстановления. Последнее объясняется тем, что по сравнению с обычным p-n-переходом у таких диодов отсутствует диффузия, связанная с инжекцией неосновных носителей, т.е. они работают только на основных носителях, а их быстродействие определяется только барьерной ёмкостью.

Теоретически диод Шоттки может обладать низкой электрической ёмкостью барьера Шоттки. Отсутствие p-n-перехода позволяет повысить рабочую частоту.

2.2.2. Для выпрямительного диода получим аналогичные временные диаграммы напряжения для дискретных значений I1 = -10 mA, -50 mA, -100mA и I2 = 100mA = const.

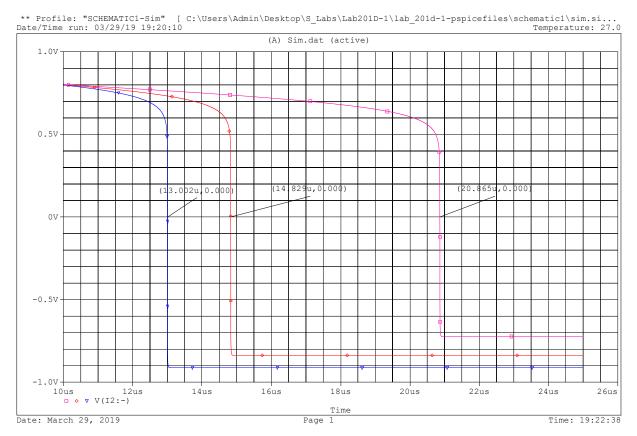


Рис. 20: D1N4002

$$\tau_{\text{pac}} = 3.56us; \ \tau_p = \frac{\tau_{\text{pac}}}{1 + \ln\left(\frac{I_2}{-I_1}\right)} = 1.72us$$

$$\tau_{\text{pac}} = 5.79us; \ \tau_p = \frac{\tau_{\text{pac}}}{1 + \ln\left(\frac{I_2}{-I_1}\right)} = 3.36us$$

$$\tau_{\text{pac}} = 13.37us; \ \tau_p = \frac{\tau_{\text{pac}}}{1 + \ln\left(\frac{I_2}{-I_1}\right)} = 5.78us$$